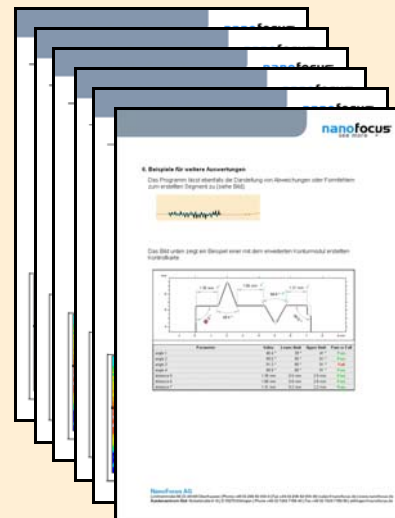


Endlich ist es soweit! Die Version 5.1 der μ soft analysis steht für alle μ soft analysis 5.0 - Nutzer zum kostenfreien Update bereit.

Die Vorteile in Kürze:

- Nutzer von Multicore Rechnern können sich über schnellere Auswertungen freuen.
- Alle aufgenommenen Daten wie Höhe, Reflexion und ggf. Farbbild werden bequem in einem Multi-Layer-Studienobjekt dargestellt und sind voll auswertbar.
- Das Modul Konturanalyse wurde um vielfältige Funktionen erweitert. Damit steht allen Nutzern nun ein leistungsstarkes Modul zur Bestimmung von Abmessungen und Winkeln zur Verfügung. Tipp #5 gibt eine Starthilfe zur Arbeit mit dem Programm.
- Die Version 5.1 kann optional um ein Statistikmodul zur dynamischen Serienauswertung von Parametern erweitert werden.



Wie bekomme ich mein Update?

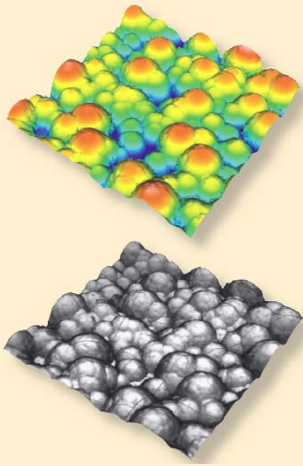
Schreiben Sie eine Email an analysis@nanofocus.de. Sie erhalten von uns einen **Link zum Download** der notwendigen Dateien und eine Installationsanleitung.

Schnellere Auswertung und Datenverarbeitung

Mit der Version 5.1 ist in Punkto Schnelligkeit ein wesentlicher Schritt nach vorn gelungen. Dank der vollen Integration der Multicore-Technologien werden zeitintensive Berechnungen in spürbar kürzerer Zeit durchgeführt (siehe Tabelle rechts). Zur vollen Nutzung empfehlen wir die Erweiterung des Arbeitsspeichers auf mindestens 3 GB.

Function	Estimated Time Gain*
Line correction	x 4
Morphological filtering	x 11
Series of profiles creation	x 2
Fill in non-measured points	x 12
Conversion of a surface to a series of profiles	x 3

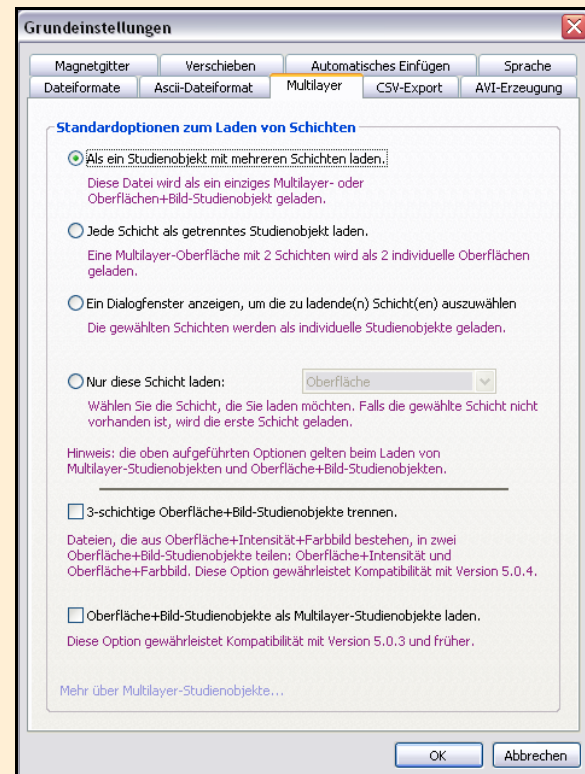
Darstellung und Analyse von Multi-Layer-Messungen



Von den in Tipp #2 "Einlesen von Topografie und Reflexionsdaten" beschriebenen Vorteile können nun **alle** Nutzer der μ soft analysis profitieren. Die mit der Messung aufgenommenen Reflexions- und ggf. Farbinformationen werden direkt mit in das Studienobjekt als einzelne Ebene (Layer) übernommen. Diese Daten lassen sich ebenfalls mit der μ soft analysis auswerten (z.B. zur Analyse von Reflexionsgrad oder Defekterkennung). Die überlagerte Darstellung von Höhen- mit Reflexions- oder Farbdaten eröffnet ganz neue Perspektiven zur visuellen Beurteilung Ihrer Oberfläche.

Sie möchten Tipp #2 gerne lesen? Laden Sie diesen in unserem Newsletterarchiv unter <http://www.nanofocus.de/service/newsletterarchiv> herunter.

Falls Ihre Daten nicht als Multi-Layer-Objekt dargestellt werden, prüfen Sie bitte die Einstellungen unter Optionen > Grundeinstellungen > Multilayer. Die richtige Auswahl sehen Sie im Bild rechts.

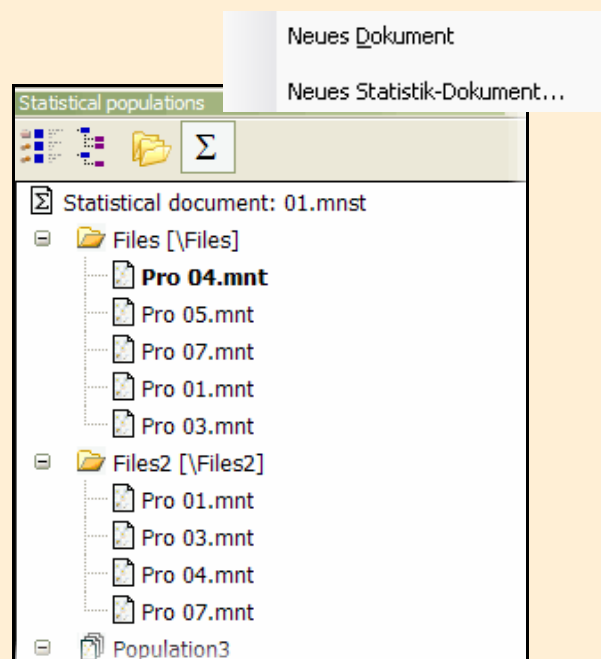


Statistische Parameter-Auswertung von statischen und dynamischen Messdaten

Mit dem Statistikmodul lassen sich Parameter-Statistiken einfach erstellen, ändern und organisieren.

Das Modul kann erstmals sowohl statische (fester Ort und feste Anzahl an Messdaten) als auch dynamische (automatische Aktualisierung bei neuen Messdaten) Populationen auswerten.

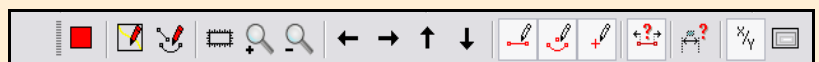
Populationen sind μ soft analysis-Dokumente, aus denen Sie die gewünschten Parameter zur Auswertung in ein Statistik-Dokument übernehmen können.



Leistungsstarke Konturanalyse

Mit dem Modul der Konturanalyse steht nun ein leistungsstarkes Instrument zur dimensionellen Analyse von Profilen zur Verfügung.

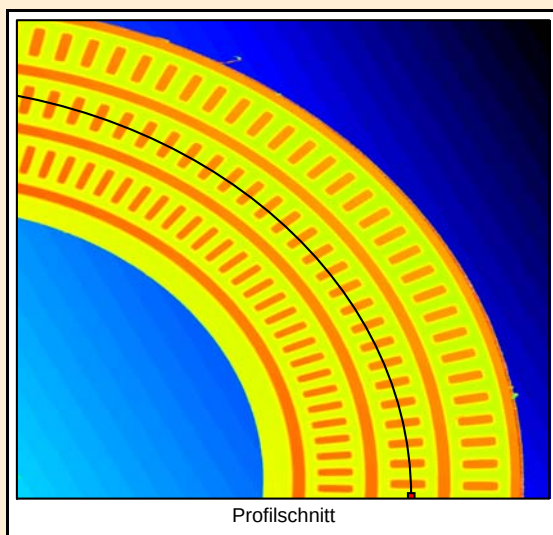
Im folgenden finden Sie ein Beispiel für solch eine Analyse. Dies soll einen kleinen Einblick und eine Startilfe für die Arbeit mit dem komplett überarbeiteten und erweiterten Modul. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen im Rahmen einer Schulung die Lösung zu Ihrer individuellen Messaufgabe. Schreiben Sie an unser Applikationsteam unter application@nanofocus.de oder rufen Sie uns an: 0208-62 000 -0.



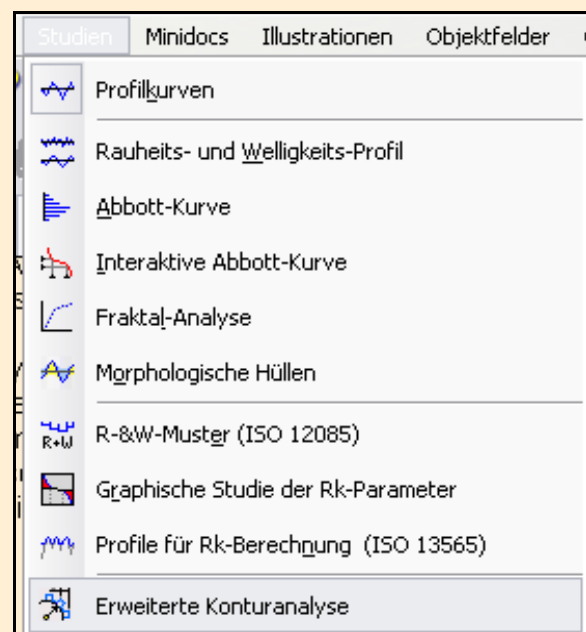
Die alte Menüleiste im Vergleich zur neuen Menüleiste. Die starke Erweiterung der Funktionspalette ist deutlich zu erkennen.



1. Wählen Sie den gewünschten Profilschnitt

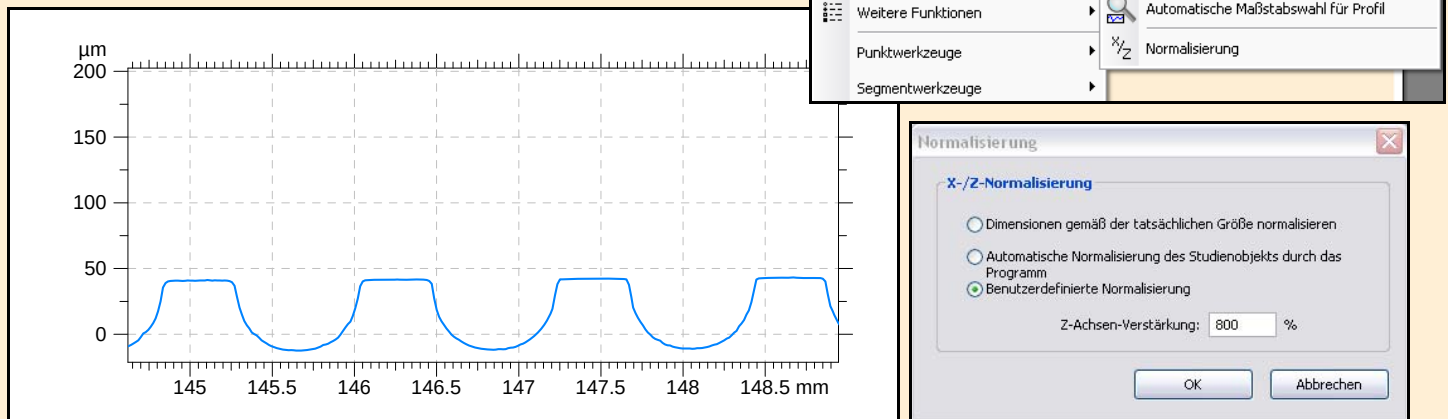


2. Klicken Sie unter Studien auf Erweiterte Konturanalyse.



3. Ändern der Ansicht

Vergrößern Sie über das Zoomwerkzeug > x/z
Normalisierung: (rechter Mausklick) den Profilschnitt.



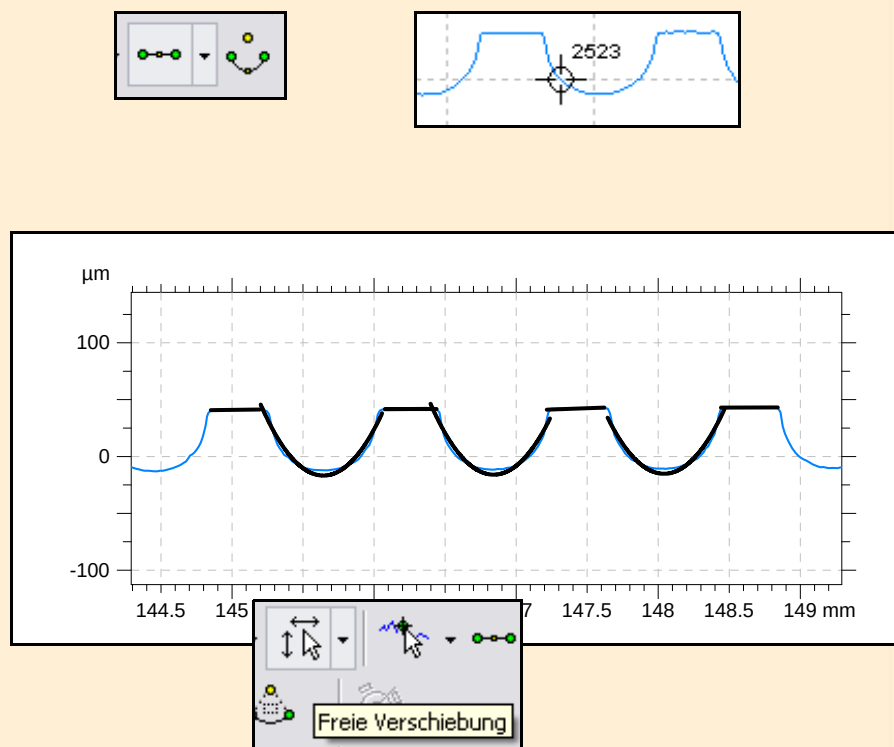
Zur Info:

Zur Vorverarbeitung stehen zahlreiche Elemente wie Festlegen des Ursprungs, Ausrichten oder Ausbessern fehlerhafter Stellen im Profil zur Verfügung auf die im Rahmen dieses Tipps nicht eingegangen wird.

4. Erstellen von Segmenten und Bögen

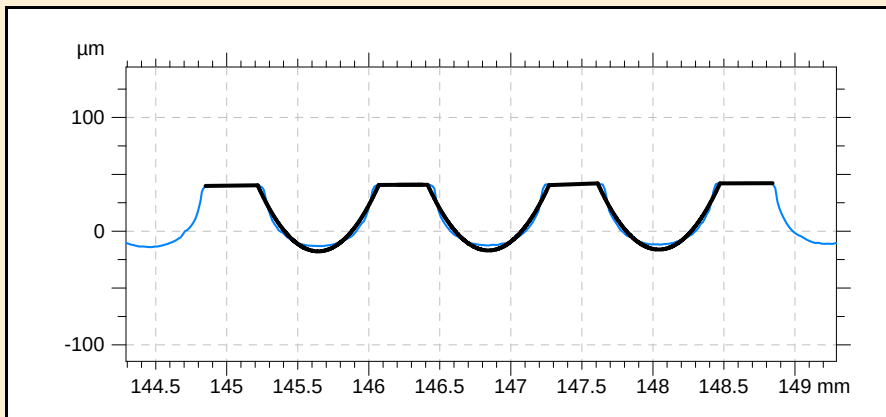
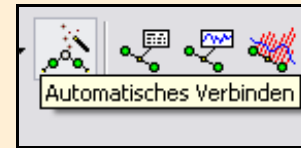
Das Profil wird nun mit Segmenten und Bögen erstellt werden. Dabei werden an das Profil angepasste ideale Formen erzeugt. Dazu wird die Funktion Segmente bzw. Bögen erzeugen verwendet (siehe Bild rechts). Der jeweilige Abschnitt im Profil wird markiert. Das erstellte Segment bzw. der erstellte Bogen schmiegt sich dem vorhandenen Profil an und wird in der gewählten Farbe dargestellt. Neben Segmenten und Bögen können auch einzelne Punkte, Schnittpunkte oder Kreise zur Nachbildung des Profils verwendet werden.

Korrekturen der einzelnen Anfangs- und Endpunkte sind mit der Funktion "Freie Verschiebung" einfach durchzuführen.



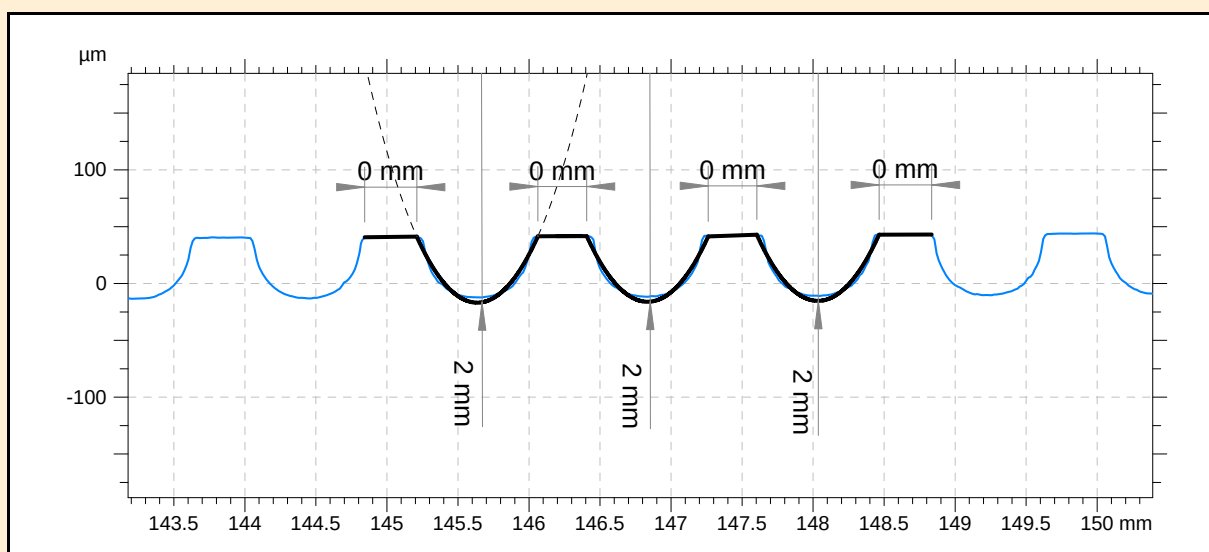
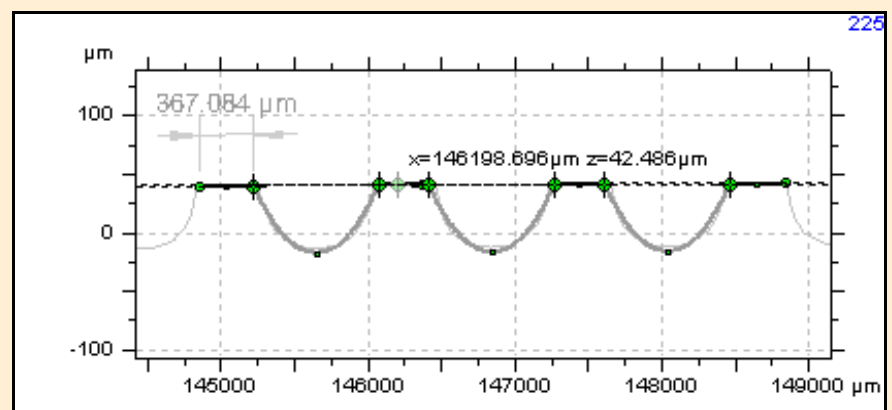
5. Verbinden der Segmente

Über "Automatisches Verbinden" wird aus den einzelnen Segmenten ein zusammenhängendes Profil. Damit haben Sie die Basis für die weitere Analyse geschaffen.



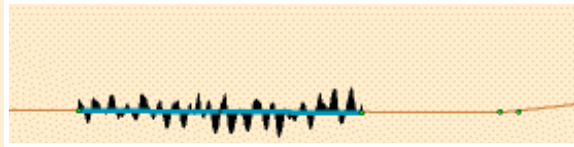
6. Bemaßung

Möglich sind horizontale, vertikale oder schiefe Bemaßung von Abständen, Radien, Durchmessern und Winkeln. Die einzelnen Abstände von Punkt zu Punkt sollen nun bemaßt werden. Dies kann mit der automatischen Bemaßung oder manuell z.B. über die horizontal/vertikale Bemaßung oder Punkt-zu-Punkt Bemaßung durchgeführt werden.



6. Beispiele für weitere Auswertungen

Das Programm lässt ebenfalls die Darstellung von Abweichungen oder Formfehlern zum erstellten Segment zu (siehe Bild).



Das Bild unten zeigt ein Beispiel einer mit dem erweiterten Konturmodul erstellten Kontrollkarte.

